



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20081203000A
2009年1月14日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎

SN74LVTH162244製品 チップシュリンクのご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	<input checked="" type="checkbox"/> Design/Specification	<input checked="" type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	SN74LVTH162244 製品 チップシュリンク 現行：チップシュリンク 未対応 変更後：チップシュリンク 対応			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	4月中旬より予定しています。 (サンプル出荷は、1月中旬より予定しています。)			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) SN74LVTH162244 製品について、この製品に使用のチップを改定し認定しました。改定内容は動作回路設計に変更のないチップシュリンクで、チップレビジョンも更新いたします。また、製品名を含め電気的特性の変更は一切なく、お客様におかれましては、現行品同様にご使用いただけます。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
チップシュリンク	未対応	対応

理由：製品供給能力向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
74LVTH162244DGGE4	74LVTH162244DLRG4	74LVTH162244ZQLR	SN74LVTH162244DGGR	SN74LVTH162244DLR
74LVTH162244DGGG4	74LVTH162244GRDR	74LVTH162244ZRDR	SN74LVTH162244DL	SN74LVTH162244KR
74LVTH162244DGGRG4	74LVTH162244GRE4	SN74LVTH162244DGG	SN74LVTH162244DLG4	

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2007年1月1日	終了	2007年3月30日
信頼性試験結果				
Qual Device : SN74LVTH162244DLR				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
ESD	HBM 4000 V		3/0	
ESD	MM 250 V		3/0	
ESD	CDM 1500 V		3/0	
Electric Characterization	Per device spec		Approved	
Latch-up	JESD 78, Class II		6/0	